

ПРИМЕСНЫЕ СОСТОЯНИЯ ВАНАДИЯ В ТЕЛЛУРИДЕ КАДМИЯ И ЦИНКА

© Ю.П.Гнатенко,* Р.В.Гамерник,[†] И.А.Фарина,*
В.С.Блашків,[†] А.С.Крочук[†]

*Институт физики Национальной академии наук Украины,
252650 Киев, Украина

[†]Львовский государственный университет им. Ив. Франко
(Получена 9 ноября 1995 г. Принята к печати 26 декабря 1995 г.)

Проведены низкотемпературные исследования оптических (4.5 K) и фотоэлектрических свойств кристаллов CdTe и ZnTe, легированных ванадием. Для $3d^3$ -иона ванадия определены энергии перехода носителей в зоны проводимости и валентную, а также энергии Мотта-Хаббарда в обоих кристаллах. Обнаружен резонанс возбужденного ${}^4T_1({}^4P)$ -состояния иона V^{2+} с зоной проводимости кристалла CdTe.

Практическое использование полупроводников в значительной степени определяется наличием в них примесных атомов, среди которых особый интерес представляют атомы группы железа. Присутствие таких примесей в кристаллах приводит к образованию сильно локализованных центров, которые в большинстве случаев образуют глубокие уровни в запрещенной зоне. Поэтому наличие таких центров существенно изменяет оптические и фотоэлектрические свойства кристаллов.

Легированные ванадием кристаллы CdTe интенсивно исследуются в последнее время как перспективный фотоперефрактивный материал для ближней ИК области спектра [1]. Изучению процессов фотоперезарядки примесных центров, определению положения энергетических уровней примесных ионов в различных зарядовых состояниях и изменению оптических и фотоэлектрических свойств кристаллов в процессе легирования посвящена данная работа. С этой целью нами изучены спектры примесного поглощения и фотогальванического тока (ФГТ) кристаллов CdTe и ZnTe, содержащих различные концентрации примесного ванадия.

Методика эксперимента

Исследуемые в настоящей работе кристаллы получены методом Бриджмена. Легирование проводилось в процессе роста. Концентрация примеси рассчитывались по загрузке в шихту. Кристаллы выращивались в кварцевых графитизированных ампулах, вакуумированных

до 10^{-5} мм рт.ст., что обеспечивало практическое отсутствие контакта расплавленной шихты с кислородом в процессе роста и отсутствие кислородосодержащих комплексов в кристаллах. Удельное сопротивление кристаллов не превышало 10^8 Ом · см. Для изменения спектров поглощения и ФГТ изготавливались плоскопараллельные пластинки необходимой толщины методом механической шлифовки и полировки с последующим травлением в полирующем травителе. Контакты для измерения ФГТ наносились в виде колец пайкой индием и проверялись на омичность. Измерения спектров поглощения и ФГТ проводилось на установке КСВУ-23 по стандартным методикам [2]. Спектральная ширина щели монохроматора не превышала 1 мэВ. Для регистрации ФГТ использовался вольтметр-электрометр В7-30. Спектры ФГТ нормировались на одинаковое количество падающих квантов. Для низкотемпературных измерений кристаллы охлаждались в гелиевом (азотном) криостате в газовом потоке. Температура измерялась термопарой и регулировалась в диапазоне $4.5 \div 300$ К с точностью $T = \pm 0.1$ К.

Экспериментальные результаты

На рис. 1 представлены результаты измерения примесного поглощения кристаллов CdTe:V, $N = 10^{19}$ см $^{-3}$, при $T = 78$ К (кривая 1) и $T = 4.5$ К (кривая 2). Увеличение поглощения данных кристаллов в области 0.85 и 1.22 эВ при понижении температуры от 78 до 4.5 К свидетельствует, что эти полосы поглощения вызваны внутрицентровыми переходами в ионах V $^{2+}$, что согласуется с результатами работы [3]. Вместе с тем полоса 1.22 эВ накладывается спектрально на широкую область фотоионизационного поглощения, обнаруженного в работе [4].

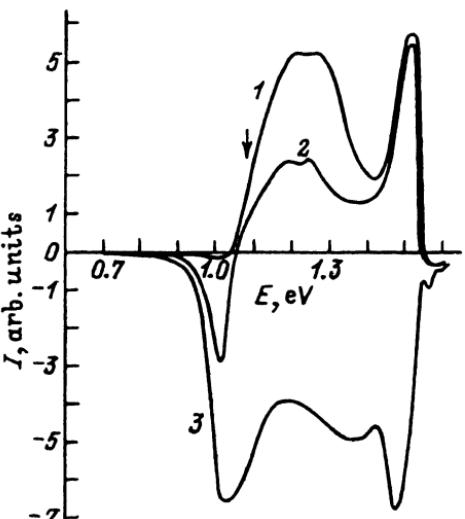
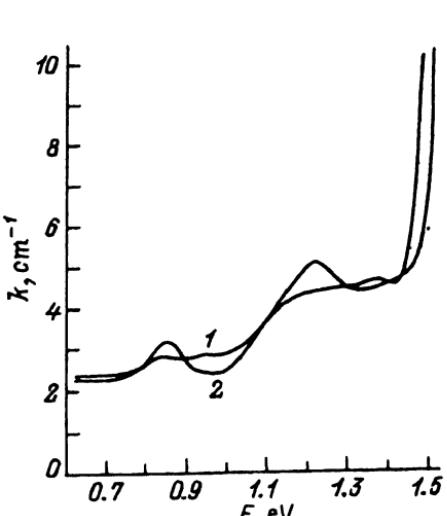


Рис. 1. Спектр поглощения кристаллов CdTe:V, $N = 10^{19}$ см $^{-3}$. T , К: 1 — 78, 2 — 4.5.

Рис. 2. Спектры фотогальванического тока кристаллов CdTe:V, $N = 10^{19}$ см $^{-3}$, $T = 78$ К. 1 — кристалл, охлажденный в темноте; 2 — кристалл, предварительно освещенный квантами $h\nu = 1.2$ эВ на протяжении 10 мин; 3 — кристалл, предварительно освещенный квантами $h\nu = 1.2$ эВ ($\sim 10^{-4}$ Вт) на протяжении 2 ч.

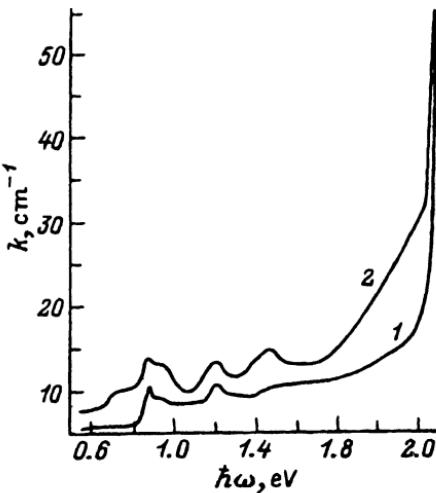


Рис. 3. Спектры поглощения кристаллов ZnTe:V при $T = 78$ К. N , см^{-3} : 1 — $5 \cdot 10^{18}$; 2 — $5 \cdot 10^{19}$.

Кроме этого при $T = 4.5$ К в области 1.48 эВ наблюдается небольшая полоса поглощения.

В спектрах ФГТ кристаллов CdTe:V, $N = 10^{19} \text{ см}^{-3}$, сигнал в области меньше 0.85 эВ отсутствует. Для свежепрепарированных кристаллов характерными являются две полосы ФГТ положительной полярности с максимумами 1.25 и 1.51 эВ и отрицательной полярности в области зона-зонных переходов. После непродолжительного (~ 10 мин) освещения данных кристаллов при $T = 78$ К светом в области полосы 1.1 \div 1.3 эВ в спектре ФГТ возрастает интенсивность полосы отрицательной полярности с максимумом 1.02 эВ (рис. 2, кривая 2). При более значительном (~ 2 ч) освещении исследуемых образцов в той же области (1.1 \div 1.3 эВ) наблюдается значительное увеличение интенсивности указанной полосы ФГТ отрицательной полярности на фоне уменьшения интенсивности полного исчезновения полосы положительной полярности в области 1.1 \div 1.3 эВ.

На рис. 3 представлены спектры поглощения кристаллов ZnTe, легированных различной концентрацией ванадия (кривые 1 и 2 соответствуют концентрациям $N = 5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ и $N = 5 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$). Для кристаллов с концентрацией примеси $N = 5 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ наблюдаются узкие полосы поглощения с максимумами 0.88 и 1.22 эВ. Кроме этого для данного кристалла наблюдаются широкие полосы поглощения при 0.97 эВ и в области 1.4 \div 1.6 эВ. Край собственного поглощения затягивается до 1.8 эВ. Увеличение концентрации примеси до $N = 5 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}$ в данных кристаллах приводит к существенным изменениям спектра поглощения. Появляется полоса 0.75 эВ, которая накладывается на низкоэнергетическое крыло полосы 0.88 эВ. Увеличивается поглощение и уширивается полоса (особенно ее низкоэнергетическое крыло) 1.22 эВ. Форма этой полосы допускает возможность наложения двух полос с близкими энергиями перехода. Увеличивается поглощение в области 1.4 \div 1.5 эВ, появляется дополнительное бесструктурное поглощение в области 1.8 \div 2.2 эВ, которое накладывается на затянутый край собственного поглощения.

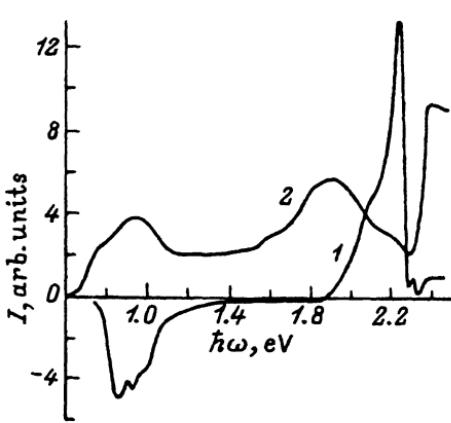


Рис. 4. Спектры фотогальванического тока кристаллов ZnTe:V при $T = 78$ К. N , см^{-3} : 1 — $5 \cdot 10^{18}$; 2 — $5 \cdot 10^{19}$.

На рис. 4 представлены спектры ФГТ данных кристаллов при $T = 78$ К (кривая 1 соответствует $N = 5 \cdot 10^{18}$ см $^{-3}$, кривая 2 — $N = 5 \cdot 10^{19}$ см $^{-3}$). При малых концентрациях ванадия в области 0.9 эВ наблюдается интенсивная структурная полоса отрицательной полярности. Энергетическое положение провала интенсивности в данной полосе соответствует максимуму полосы поглощения 0.88 эВ. На высокоЕнергетическом крыле данной полосы наблюдается другая особенность в виде провала интенсивности, которая, как будет показано далее, обусловлена наложением полосы ФГТ положительной полярности. В области 1.9–2.2 эВ наблюдается интенсивная дублетная полоса с максимумами в 2.17 и 2.23 эВ.

Для кристаллов ZnTe:V с концентрацией ванадия $N = 5 \cdot 10^{19}$ см $^{-3}$ в низкоенергетической части спектра наблюдается полоса положительной полярности с максимумом 0.95 эВ, низкоенергетический край которой деформирован, что обусловлено дополнительным по сравнению с малыми концентрациями примеси поглощением. Кроме того, в данном спектре наблюдается интенсивная полоса положительной полярности 1.85 эВ. На ее высокоЕнергетическом крыле видна структура, обусловленная наложением на нее полосы такой же полярности 1.6 эВ. В отличие от кристаллов с малой концентрацией ванадия в данном случае наблюдается резкое уменьшение интенсивности полосы 2.17 эВ.

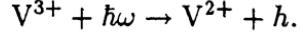
Обсуждение результатов

Известно [5], что энергетическое положение валентных зон кристаллов CdTe и ZnTe, а также уровней примесных ионов одинакового зарядового состояния атомов переходных металлов группы железа по отношению к уровню вакуума совпадают. Именно поэтому для исследования нами были выбраны кристаллы CdTe:V и ZnTe:V. В эксперименте мы наблюдали ионизацию электронов с уровня $E_c - 1.08$ эВ для кристаллов CdTe:V и с уровня $E_c - 1.90$ эВ для кристаллов ZnTe:V. Следовательно, учитывая различие в ширинах запрещенных зон данных кристаллов, можно предположить, что данные энергетические уровни соответствуют одному и тому же примесному иону. Кроме того, для кристаллов CdTe:V при любых концентрациях примеси ФГТ в области 0.8 эВ (полоса поглощения, соответствующая электронному переходу ${}^4T_1({}^4F) \rightarrow {}^4A_2({}^4F)$) отсутствует, полоса поглощения 1.22 эВ (переход ${}^4T_1({}^4F) \rightarrow {}^4T_1({}^4P)$) всегда уширена и сопровождается выбросом электронов в зону проводимости. Для кристаллов ZnTe:V ни одна из названных полос внутренцентрового поглощения не сопровождается выбросом электронов в зону проводимости. Из этого можно заключить, что данный примесный уровень принадлежит основному состоянию примесного иона V^{2+} . Возбужденное ${}^4A_2({}^4F)$ -состояние для обоих кристаллов находится в запрещенной зоне. Другое возбужденное ${}^4T_1({}^4P)$ -состояние для кристаллов ZnTe:V находится в запрещенной зоне, а для кристаллов CdTe:V попадает в зону проводимости. Так как электронный переход между состояниями ${}^4T_1({}^4F) \rightarrow {}^4T_1({}^4P)$ разрешен, в результате взаимодействия дискретного ${}^4T_1({}^4P)$ -состояния иона V^{2+} с зонными состояниями кристалла CdTe наблюдается резонанс Фаено, вследствие чего электроны из возбужденного состояния становятся электронами проводимости, а полоса поглощения уширяется. Аналогичная ситуация ранее наблюдалась для примеси Cr в GaAs [6] и примеси Ti в кристаллах CdTe [2].

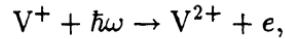
Сложный контур полосы ФГТ положительной полярности в области $1.1 \div 1.3$ эВ для кристаллов CdTe:V объясняется тем, что электроны под действием световых квантов из основного ${}^4T_1({}^4F)$ -состояния иона V^{2+} переходят как непосредственно в зону проводимости, так и на возбужденный ${}^4T_1({}^4P)$ -уровень с дальнейшей автоионизацией. Эти два фотоионизационных процесса играют основную роль при перезарядке примесных центров из состояния V^{2+} в состояние V^{3+} . В результате такой перезарядки происходит изменение собственных структурных дефектов: вакансии кадмия из однократно ионизованного переходят в двукратно ионизованное состояние и проявляются другие дефекты, создающие донорные уровни $E_v + 1.48$ и $E_v + 1.57$ эВ.

Небольшие провалы в полосах ФГТ для кристаллов CdTe:V в 1.22 эВ (рис. 2, кривые 1 и 2) и для кристаллов ZnTe:V в области 0.90 эВ (рис. 4, кривая 1) объясняются тем, что полученный спектр пронормирован на одинаковое количество падающих квантов, а часть из них принимает участие в возбуждении внутренних оптических переходов и, соответственно, уменьшается количество квантов, возбуждающих фотоионизационный переход.

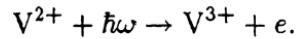
Полоса отрицательной полярности в спектре ФГТ кристаллов ZnTe:V, $N = 5 \cdot 10^{18}$ см $^{-3}$ (рис. 4, кривая 1), как и полоса 1.02 эВ для кристаллов CdTe:V (рис. 2, кривые 2, 3), соответствует фотоионизационному переходу



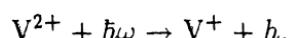
Интенсивная дублетная полоса с максимумами 2.17 и 2.23 эВ и провалом в 2.3 эВ на этом же рисунке может быть обусловлена переходом электронов с акцепторных уровней $E_c - 2.17$ эВ и $E_c - 2.27$ эВ на донорный уровень $E_c - 0.09$ эВ. Данные акцепторные уровни, согласно [7], соответствуют двукратно- и однократно заряженным вакансиям цинка. Наличие донорных уровней может быть обусловлено присутствием в кристалле неконтролируемых примесей третьей группы (In, Ga, Al) в катионном узле кристаллической решетки. Увеличение сигнала ФГТ положительной полярности в области зона-зонных переходов при увеличении концентрации легирующего ванадия в ZnTe свидетельствует об уменьшении концентрации свободных дырок в кристалле и о тенденции к изменению типа проводимости. На это же указывает уменьшение интенсивности полосы 2.17 эВ и исчезновение полосы 2.27 эВ. Фотоионизационная полоса положительной полярности 0.96 эВ, наблюдалась для кристаллов ZnTe:V, $N = 5 \cdot 10^{19}$ см $^{-3}$ (рис. 4, кривая 2), может соответствовать фотоионизационному переходу



а интенсивная полоса 1.85 эВ в том же кристалле — переходу



Особенность на низкоэнергетическом крыле последней полосы обусловлена наложением слабоинтенсивной полосы отрицательной полярности с энергией 1.62 эВ. Соответствующее поглощение обусловлено фотоионизационным переходом



Увеличение поглощения кристаллов ZnTe:V в области 0.75 эВ при увеличении концентрации примеси можно объяснить присутствием в кристаллической матрице атомов ванадия не только в состоянии V^{2+} , но и в состоянии V^{3+} . Электронные свойства ионов V^{3+} определяются двумя электронами на 3d-оболочке. Поэтому по аналогии с ионами Ti^{2+} основным состоянием иона V^{3+} следует считать $^3A_2(^3F)$. Возбужденное $^3T_1(^3F)$ -состояние расположено на ~ 0.75 эВ выше основного. Внутрицентровой электронный переход между этими состояниями иона V^{3+} и приводит к дополнительному поглощению в данной области.

Сравнение экспериментально полученных энергий донорных и акцепторных уровней ионов V^+ и V^{2+} в кристаллах ZnTe показывает, что энергия Мотта-Хаббарда для ионов V^+ составляет 0.20 эВ, а для ионов V^{2+} — 0.40 эВ. В кристаллах CdTe:V энергия Мотта-Хаббарда в кристаллах CdTe обусловлена меньшей ковалентностью связей по сравнению с ZnTe. Энергия выброса дырки в валентную зону для ионов V^{2+} близка в обоих кристаллах, что и следовало ожидать из универсальной схемы расположения энергетических уровней ионов одинакового зарядового состояния для полупроводников группы $A^{II}B^{VI}$ [8], поскольку положения валентных зон кристаллов CdTe и ZnTe по отношению к уровню вакуума совпадают. Становится понятным, почему в кристаллах CdTe:V не наблюдаются фотоионизационные переходы с участием иона V^+ . Как следует из результатов по исследованию кристаллов ZnTe:V, положение энергетического уровня V^+ находится на 1.62 эВ выше вершины валентной зоны, что больше ширины запрещенной зоны CdTe, т. е. данный уровень находится в резонансе с зоной проводимости.

Список литературы

- [1] A.A.Schroeder, T.S. Stark, A.L. Smirl, G.C. Valley. Opt. Commun., **84**, 369 (1991).
- [2] П.И. Бабий, Р.В. Гамерник, Ю.П. Гнатенко, А.С. Крочук. ФТП, **23**, 739 (1989).
- [3] P.A. Slodwy, J.M. Baranowski. Phys. St. Sol. (b), **49**, 499 (1972).
- [4] L.M. Hoang, J.M. Baranowski. Phys. St. Sol. (b), **84**, 361 (1977).
- [5] A. Zunger. Ann. Rev. Mater. Sci., **15**, 411 (1985).
- [6] Г.К. Ипполитова, Э.М. Омельянинский, А.Д. Первова. ФТП, **9**, 1308 (1975).
- [7] K. Suto, M. Aoki. J. Phys. Japan, **22**, 149 (1967).
- [8] В.И. Соколов. ФТП, **28**, 545 (1994).

Редактор В.В. Чалдышев

Impurity states of vanadium in cadmium and zinc tellurides

Yu.P. Gnatenko,¹ R.V. Gamernik,² I.O. Farina,¹ B.S. Blazhkhiv,²
A.S. Krochuk.²

¹ Institute of Physics of National Academy of Sciences, 252650 Kiev, the Ukraine

² Lvov State University, 290000 Lvov, the Ukraine

Low-temperature optical (4.5 K) and photoelectrical properties of CdTe and ZnTe crystals doped by vanadium are investigated. The energies of carrier transition to valence and conduction bands, Mott-Hubbard energy for $3d^3$ -ion vanadium in both crystals are determined. The resonance of the excited $^4T_1(^4P)$ -state of V^{2+} -ion with the conduction band of CdTe crystal is found.